



УНИВЕРЗИТЕТ
У НОВОМ САДУ



ФАКУЛТЕТ
ТЕХНИЧКИХ НАУКА

Трг Доситеја Обрадовића 6, 21000 Нови Сад, Република Србија
Деканат: 021 6350-413; 021 450-810; Централa: 021 485 2000
Рачуноводство: 021 458-220; Студентска служба: 021 6350-763
Телефакс: 021 458-133; e-mail: ftndeans@uns.ns.ac.yu



Сертификован
систем
квалитета



81. Sastanak IEEE u Novom Sadu / 81th IEEE Meeting in Novi Sad
Obaveštavamo sve zainteresovane / Announcement

Prof. dr Svetlana Avramov-Zamurović

IEEE Member

United States Naval Academy
Weapons and Systems Department
ANNAPOLIS, USA
<http://www.usna.edu>

u **utorak, 07. 04. 2009.** u Svečanoj Sali
Fakulteta tehničkih nauka u Novom
Sadu, sa početkom u **11:00 h**, održaće

On **Tuesday, April 7, 2009**, in Ceremonial
Hall of Faculty of Technical Sciences, at
11:00 am will deliver

P R E D A V A N J E L E C T U R E

METODA SAŽETOG PRONALAZŽENJA INFORMACIJA (ZDUDANO OSEĆANJE)

Compressive sensing

Abstract: Metoda Sažetog pronalazažnja informacija predstavlja sasvim novi način prikupljanja uzorka koncentrišući samo ono što je korisniku značajno. Oblast je začeta pre nekoliko godina i mnogi naučnici, kako matematičari, tako i inženjeri i fizičari, vide potencijal u raznovrsnim primenama. Predavanje će predstaviti matematički aparat i pikazati eksperimente, koji uspešno koriste tu metodu sa osvrtom na njene mogućnosti i ograničenja. U okviru matematičkog aparata predlaže se uzimanje izabranih odmeraka, koji nose informaciju. Metoda je bazirana na činjenici da se originalna informacija može predstaviti sa svega nekoliko značajnih komponenti i da se u procesu uzimanja podataka mere linearne kombinacije originalnih odbiraka, koji moraju da sačuvaju strukturu informacije. Ova kompresija je bez gubitaka i značajno smanjuje količinu uzoraka koju zahteva Nyquistovo odabiranje.

Suorganizatori: Katedra za električna merenje i

 IEEE <i>Networking the World™</i>	IEEE – Serbia & Montenegro Section	  
	Joint Chapter – Power Electronics, Industrial Electronics & Industry Applications Society	
	NOVI SAD www.ftn.ns.ac.yu/ieee	